ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

AEL-05 การใบอัสทรานซิสเตอร์ประเภท BJT

วัตถุประสงค์ของการทดลอง

- 1. ศึกษาวงจรไบอัสทรานซิสเตอร์ประเภท BJT
- 2. ศึกษาความไวของจุดทำงานต่ออุณหภูมิของวงจรไบอัส

การใบอัสทรานซิสเตอร์เป็นการให้ไฟเลี้ยงแก่ทรานซิสเตอร์ ทำให้ทรานซิสเตอร์อยู่ในสภาวะ แอกทีฟ (active) พร้อมที่จะขยายสัญญาณไฟสลับได้. เราจะเรียกแรงคัน V_{CE} และกระแส I_C ของ ทรานซิสเตอร์ที่เกิดจากการใบอัสว่า จดทำงานสงบ (quiescent-point หรือ Q-point).

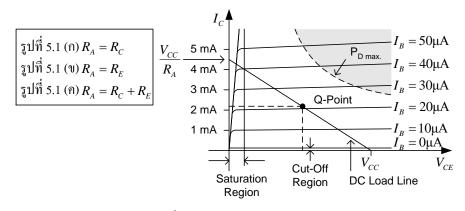
พารามิเตอร์บางตัวของทรานซิสเตอร์ประเภท bipolar junction มีค่าไวต่ออุณหภูมิ. เมื่ออุณหภูมิ สูงขึ้น ค่าอัตราขยายกระแสตรง β_{dc} มีค่าเพิ่มขึ้น และแรงคัน $|V_{BE}|$ จะเปลี่ยนไปประมาณ -2.5 mV/°C. ผล จากการเปลี่ยนไปของ β_{dc} และขนาดของ V_{BE} โดยทั่วไปจะทำให้ทรานซิสเตอร์ซึ่งต่ออยู่ในวงจรขยาย สัญญาณ มีจุดทำงานที่เปลี่ยนไปในลักษณะที่ ขนาดของ V_{CE} ลดลงและ I_C สูงขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น. แต่ วงจรที่ใช้ใบอัสทรานซิสเตอร์บางวงจร จะทำให้ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการเปลี่ยนค่าของจุดทำงานสงบ (Qpoint shift) ลดลงได้.

5.1. การหาจุดทำงานสงบโดยการเขียน DC Load Line

การให้ไฟเลี้ยงวงจรทรานซิสเตอร์ที่เหมาะสม จะทำให้สามารถขยายสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับทั้ง ซีกบวกและลบได้พอกัน โดยสัญญาณไม่เกิดการขลิบซีกใดซีกหนึ่งก่อน. V_{CEQ} ที่เหมาะสมจึงมีค่าประมาณ ครึ่งหนึ่งของแรงดันแหล่งจ่ายไฟ V_{CC} (midpoint bias) ดังแสดงในรูปที่ 5.1.

รูปที่ 5.1 ตัวอย่างการต่อทรานซิสเตอร์ประเภท BJT ชนิด NPN ในวงจรขยาย.

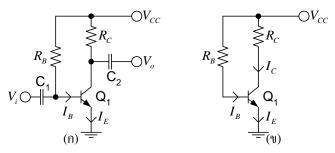
จากกราฟกุณสมบัติระหว่าง V_{CE} และ I_C ของทรานซิสเตอร์ที่แสดงในรูปที่ 5.2 เราสามารถหาจุด ทำงานสงบของทรานซิสเตอร์ โดยการเขียน dc load line ซึ่งเป็นเส้นตรงที่แสดงไว้ในรูป. ด้านหนึ่งของ เส้นตรงจะตัดกับแกน V_{CE} ที่แรงดัน V_{CC} . อีกด้านหนึ่งของเส้นตรงจะตัดกับแกนกระแส I_C ที่ค่า V_{CC}/R_A โดยที่ R_A เป็นความต้านทานรวมทางด้าน collector และ emitter ขึ้นอยู่กับวงจร ทั้งนี้สมมุติให้ $I_C\cong I_E$ ด้วย. จุดทำงานสงบจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งบนเส้น dc load line นี้ ขึ้นอยู่กับค่า I_B ที่ใช้.



รูปที่ 5.2 การเขียน dc load line.

5.2. วงจรไบอัสแบบ Base Bias

วงจรนี้เป็นวงจรไบอัสอย่างง่ายที่สุด แต่มีปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากจุดทำงานสงบไวต่อการ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมาก. ที่ขา base และ collector ของทรานซิสเตอร์มีการต่อความต้านทาน R_B และ R_C ตามลำดับ เข้ากับแหล่งจ่ายแรงดัน V_{CC} . ส่วนขา emitter ต่อลงกราวด์ ดังแสดงในรูปที่ 5.3 (ก). ในการ วิเคราะห์ไฟกระแสตรง ให้ตัดตัวเก็บประจุออกจากวงจรได้ เนื่องจากไฟฟ้ากระแสตรงไม่ไหลผ่านตัวเก็บ ประจ. รปที่ 5.3 (ข) เป็นรูปวงจรเมื่อตัดตัวเก็บประจุออกแล้ว.

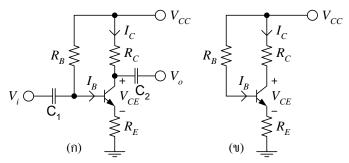


รูปที่ 5.3 วงจรไบอัสแบบคงที่ (fixed-bias circuit) ใช้ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN. การวิเคราะห์วงจรในสภาวะแอคทีฟ สามารถทำได้ดังนี้.

$$\begin{split} I_B &= \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \cong \frac{V_{CC} - 0.7}{R_B} \\ I_C &= \beta I_B \\ V_{CE} &= V_{CC} - I_C R_C \end{split}$$

5.3. วงจรไฟเลี้ยงแบบ Emitter Feedback

วงจรไบอัสชนิดนี้มีความไวต่ออุณหภูมิลคลงเมื่อเทียบกับวงจรที่แล้ว. วงจรได้แสดงไว้ในรูปที่ 5.4 (ก). ถ้าพิจารณาเฉพาะไฟตรง สามารถตัดตัวเก็บประจุทิ้งได้ ทำให้เหลือวงจรในรูปที่ 5.4 (ข).



รูปที่ 5.4 วงจรไบอัสแบบ emitter feedback ใช้ทรานซิสเตอร์ ชนิค NPN. การวิเคราะห์วงจรในสภาวะแอคทีฟ สามารถทำได้ดังนี้.

$$I_{B} = \frac{V_{CC} - V_{BE} - V_{E}}{R_{B}} = \frac{V_{CC} - V_{BE} - I_{E}R_{E}}{R_{B}} = \frac{V_{CC} - V_{BE} - (\beta + 1)I_{B}R_{E}}{R_{B}}$$

จัดเทอมต่างๆใหม่ จะได้

$$\begin{split} I_B &= \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} \\ I_C &= \beta I_B \\ I_E &= (\beta + 1)I_B \cong I_C \\ V_{CE} &= V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E \cong V_{CC} - I_C \left(R_C + R_E\right) \end{split}$$

จากการคำนวณหา I_B จะเห็นว่า ความด้านทาน R_E เมื่อมองเข้าที่ขา base เสมือนว่ามีค่าเพิ่มขึ้นเป็น $(\beta+1)R_E$. ค่า V_{CE} ที่คำนวณได้ต้องมากกว่า 0.2V โดยประมาณ ทรานซิสเตอร์จึงจะอยู่ในสภาวะ active ตามที่สมมุติไว้. มิฉะนั้น จะต้องใช้การคำนวณที่ได้อธิบายไว้ในการทดลองที่ AEL-04 เพื่อวิเคราะห์วงจร.

5.4. วงจรใบอัสแบบ Voltage Divider

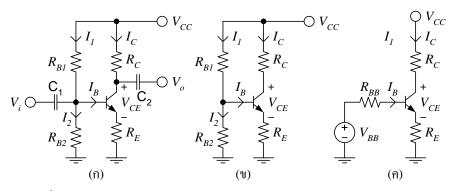
วงจรนี้ได้แสดงไว้ในรูปที่ 5.5 (ก) และเมื่อตัดตัวเก็บประจุออกไป จะได้วงจรในรูปที่ 5.5 (ข). วงจรนี้มีการทำงานกล้ายกับวงจรที่แล้ว ต่างกันที่แรงดันไบอัสที่ขา base เป็นแรงดันที่ต่ำกว่า V_{CC} โดยวงจร แบ่งแรงดัน ซึ่งประกอบด้วย R_{BI} และ R_{B2} . เราสามารถเขียนวงจรสมมูลย์แบบ Thevenin สำหรับวงจรแบ่ง แรงดันนี้ได้ ดังแสดงในรูปที่ 5.5 (ก) โดยที่

$$V_{BB} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC}$$

$$R_{BB} = R_{B1} / / R_{B2} = \frac{R_{B1} R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

คังนั้น เราสามารถคำนวณ I_B ในขณะที่ทรานซิสเตอร์อยู่ในสภาวะแอคทีฟ ได้จาก

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_{BB} + (\beta + 1)R_E}$$



รูปที่ 5.5 วงจรใบอัสแบบ voltage divider ใช้ทรานซิสเตอร์ ชนิด NPN.

และคำนวณหา I_C , I_E และ V_{CE} ได้จากสมการเคียวกันกับกรณีของวงจรไบอัสแบบ emitter feedback คังต่อไปนี้.

$$\begin{split} I_C &= \beta I_B \\ I_E &= \left(\beta + 1\right) I_B \cong I_C \\ V_{CE} &= V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E \cong V_{CC} - I_C \left(R_C + R_E\right) \end{split}$$

ถ้าเราออกแบบวงจรให้ $I_2 \ge 10I_B$ (หรือ $10R_{B2} \le \beta R_E$ โดยประมาณ) เราอาจสมมุติว่า $V_B \cong V_{BB}$ เลยก็ได้. ดังนั้น เราจะได้

$$\begin{split} V_E &= V_B - V_{BE} \cong V_{BB} - V_{BE} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} - V_{BE} \\ I_E &= \frac{V_E}{R_E} \\ I_B &= \frac{I_E}{\beta + 1} \\ I_C &= \beta I_B \cong I_E \\ V_{CE} &= V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E \cong V_{CC} - I_C \left(R_C + R_E \right) \end{split}$$

ค่า V_{CE} ที่คำนวณได้ต้องมากกว่า 0.2V โดยประมาณ ทรานซิสเตอร์จึงจะอยู่ในสภาวะ active ตามที่สมมุติไว้. มิฉะนั้น จะต้องใช้การคำนวณที่ได้อธิบายไว้ในการทดลองที่ AEL-04 เพื่อวิเคราะห์วงจร.

5.5. วงจรใบอัสแบบ Collector feedback

วงจร ใบอัสชนิดนี้ ได้แสดงไว้ในรูปที่ 5.6 (ก) จะเป็นวงจรที่มีจุดทำงานสงบไวต่ออุณหภูมิน้อย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ V_{CE} จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ I_B ในลักษณะเคียวกัน เช่น เมื่อ อุณหภูมิสูงขึ้น ค่า β_{dc} เพิ่มขึ้น V_{CE} ลดลง จะทำให้ I_B ลดลงด้วย. แต่เมื่อ I_B ลดลง V_{CE} จะเพิ่มขึ้น ซึ่งไป หักล้างการลดลงของ V_{CE} จึงทำให้ V_{CE} เปลี่ยนน้อยมาก. รูปที่ 5.6 (ข) แสดงวงจรเฉพาะส่วนที่ใช้วิเคราะห์ กระแสตรงเท่านั้น.

การวิเคราะห์วงจรในสภาวะแอคทีฟ สามารถทำได้ดังนี้.

$$I_{B} = \frac{V_{CB}}{R_{B}} = \frac{V_{CC} - V_{BE} - (I_{C} + I_{B})R_{C}}{R_{B}} = \frac{V_{CC} - V_{BE} - (\beta + 1)I_{B}R_{C}}{R_{B}}$$

จัดเทอมต่างๆใหม่ ได้ดังนี้

$$I_{B} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{B} + (\beta + 1)R_{C}} \cong \frac{V_{CC} - 0.7}{R_{B} + (\beta + 1)R_{C}}$$

$$I_{C} = \beta I_{B}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - (I_{C} + I_{B})R_{C} \cong V_{CC} - I_{C}R_{C} = V_{CC} - \beta I_{B}R_{C}$$

$$\downarrow V_{CC}$$

$$\downarrow R_{C} \otimes V_{$$

รูปที่ 5.6 วงจรไบอัสแบบ collector feedback ใช้ทรานซิสเตอร์ ชนิด NPN.

ค่า V_{CE} ที่คำนวณได้ต้องมากกว่า $0.2 \mathrm{V}$ โดยประมาณ ทรานซิสเตอร์จึงจะอยู่ในสภาวะ active ตามที่ สมมุติไว้. มิฉะนั้น จะต้องใช้การคำนวณที่ได้อธิบายไว้ในการทดลองที่ AEL-04 เพื่อวิเคราะห์วงจร.

วงจรไบอัสที่ยกตัวอย่างผ่านมาใช้ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN ทั้งหมด. วงจรขยายสัญญาณสามารถใช้ ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP ได้เช่นเดียวกัน. การวิเคราะห์วงจรที่ใช้ทรานซิสเตอร์ชนิดนี้ จะต้องระมัดระวัง ทิสทางของกระแสที่ใหล และทิสทางของแรงคันคร่อมขาต่างๆของทรานซิสเตอร์ด้วย.

5.6. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

ทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N3904	1	ตัว
R 1/4W 5% 27k Ω , 1k Ω , 820 Ω , 180 Ω ค่าละ	1	ตัว
แหล่งจ่ายแรงคัน	1	ตัว
Digital Multimeters	2	ตัว
ชดทำความร้อน	1	ชด

5.7. การทดลอง

5.7.1. การทดลองเพื่อหากระแส $m{I_B}$ ที่เหมาะสม

ต่อวงจรตามรูปที่ 5.7. ใช้ multimeter วัดค่า R_B และ R_C ที่จะใช้ในวงจร แล้วบันทึกลงในช่องว่าง ข้างล่างนี้

$$R_B = \Omega$$
 $R_C = \Omega$

ให้ V_{BB} เริ่มต้นจากค่า 0 V. ค่อยๆเพิ่มค่า V_{BB} จนกระทั่งวัด V_{CE} ได้ครึ่งหนึ่งของ V_{CC} (1/2 V_{CC} = 10 V). บันทึกค่าแรงคัน V_1 , V_{BE} และ V_{RC} แล้วคำนวณหา I_B และ β_{dc} .

$$V_1 =$$
_____V

รูปที่ 5.7 วงจรสำหรับการหา I_B ที่เหมาะสม.

ใช้ชุดทำความร้อนเพิ่มอุณหภูมิที่ตัวทรานซิสเตอร์สักครู่หนึ่งจนแรงคัน V_{CE} ไม่เปลี่ยนแปลง และ ให้แช่ชุดทำความร้อนไว้ต่อไป. บันทึกค่าแรงคัน V_1 , V_{BE} และ V_{RC} แล้วคำนวณหา I_B และ eta_{dc} .

$$V_{1}$$
 = _______ V
 V_{BE} = _______ V
 V_{RC} = _______ V
 $I_{B} = \frac{V_{1}}{R_{B}}$ = _______ A, $I_{C} = \frac{V_{RC}}{R_{C}}$ = _______ A
 $\beta_{dc} = \frac{I_{C}}{I_{B}}$ = _______

ในรายงานให้เขียนอภิปรายผลการทดลองว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อทรานซิสเตอร์อย่างไร บ้าง. (V_{BE} จะลดลงประมาณ 2.5 mV ต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส.)

5.7.2. วงจรใบอัสแบบ Base Bias

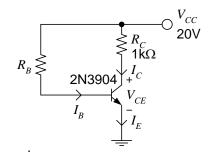
วงจรไบอัสสำหรับการทดลองนี้ ได้แสดงไว้ในรูปที่ 5.8. ให้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการทดลองที่ 5.7.1 เพื่อคำนวณหา R_B ที่จะทำให้ได้ V_{CE} เท่ากับ $10~{
m V}$.

$$R_B$$
 ที่คำนวนได้ = _______ Ω . เลือกใช้ค่า = ______ Ω . วัดได้ = ______ Ω .

ให้ใช้ตัวด้านทานที่มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่คำนวณได้ เพียงตัวเดียว (ไม่ให้ใช้ตัวด้านทานหลายตัวต่อ อนุกรม หรือขนานกัน). บันทึกค่า V_{CE} ที่ได้.

วัค
$$V_{CE}$$
 ได้ = _____ V.

ในรายงานให้อธิบายการคำนวณค่า R_B และให้คำนวณว่า ถ้าทรานซิสเตอร์มีอุณหภูมิสูงขึ้น ค่า V_{CEQ} และ I_{CQ} จะมีค่าเท่าใด โดยใช้ค่า eta_{dc} ที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการทดลองที่ 5.7.1.



รูปที่ 5.8 วงจรใบอัสแบบ base bias.

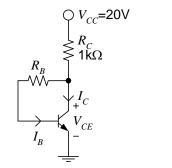
5.7.3. วงจรใบอัสแบบ Collector feedback

วงจรไบอัสสำหรับการทดลองนี้ ได้แสดงไว้ในรูปที่ 5.9. ให้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการทดลองข้อ 5.7.1 เพื่อคำนวณหา R_B ที่จะทำให้ได้ V_{CE} เท่ากับ 10 V. แสดงวิธีคำนวณในรายงานด้วย.

$$R_B$$
 ที่คำนวณได้ = Ω . เลือกใช้ค่า = Ω . วัดได้ = Ω .

ให้ใช้ตัวต้านทานที่มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่คำนวณได้ เพียงตัวเดียว (ไม่ให้ใช้ตัวต้านทานหลายตัวต่อ อนุกรม หรือขนานกัน). บันทึกค่า V_{CF} ที่ได้.

วัค
$$V_{CE}$$
 ใต้ = _____ V.



รูปที่ 5.9 วงจรไบอัสแบบ collector feedback.

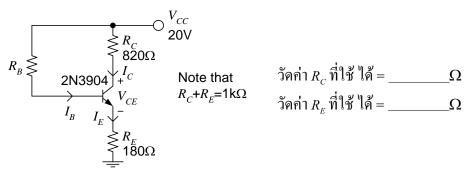
ในรายงานให้อธิบายการคำนวณค่า R_B และให้คำนวณว่า ถ้าทรานซิสเตอร์มีอุณหภูมิสูงขึ้น ค่า V_{CEQ} และ I_{CQ} จะมีค่าเท่าใด โดยใช้ค่า eta_{dc} ที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการทดลองที่ 5.7.1.

5.7.4. วงจรใบอัสแบบ Emitter feedback

วงจรไบอัสสำหรับการทดลองนี้ ได้แสดงไว้ในรูปที่ 5.10. ให้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการทดลองข้อ 5.7.1 เพื่อคำนวณหา R_B ที่จะทำให้ได้ V_{CE} เท่ากับ 10 ∇ . แสดงวิธีคำนวณในรายงานด้วย.

ให้ใช้ตัวต้านทานที่มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่คำนวณได้ เพียงตัวเดียว (ไม่ให้ใช้ตัวต้านทานหลายตัวต่อ อนุกรม หรือขนานกัน). บันทึกค่า V_{CE} ที่ได้.

วัค
$$V_{CE}$$
 ใค้ = _____ V.



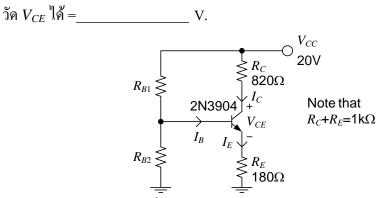
รูปที่ 5.10 วงจรไบอัสแบบ emitter feedback.

ในรายงานให้อธิบายการคำนวณค่า R_B และให้คำนวณว่า ถ้าทรานซิสเตอร์มีอุณหภูมิสูงขึ้น ค่า V_{CEQ} และ I_{CQ} จะมีค่าเท่าใด โดยใช้ค่า $oldsymbol{eta}_{dc}$ ที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการทดลองที่ 5.7.1.

5.7.5. วงจรใบอัสแบบ Voltage Divider

วงจรไบอัสสำหรับการทดลองนี้ ได้แสดงไว้ในรูปที่ 5.11. ให้คำนวณหา R_{B1} และ R_{B2} ที่จะทำให้ ได้ V_{CE} เท่ากับ $10~\rm V~$ โดยให้กระแส I_B มีค่าน้อยกว่ากระแสที่ไหลผ่าน R_{B2} ประมาณ $10~\rm ini$. ให้แสดงวิธี คำนวณในรายงานด้วย.

ให้ใช้ตัวด้านทานที่มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่คำนวณได้ เพียงตัวเดียว (ไม่ให้ใช้ตัวต้านทานหลายตัวต่อ อนุกรม หรือขนานกัน). บันทึกค่า V_{CE} ที่ได้.



รูปที่ 5.11 วงจรใบอัสแบบ voltage divider.

ในรายงานให้อธิบายการคำนวณค่า R_{B1} และ R_{B2} และให้คำนวณว่า ถ้าทรานซิสเตอร์มีอุณหภูมิ สูงขึ้น ค่า V_{CEQ} และ I_{CQ} จะมีค่าเท่าใด โดยใช้ค่า eta_{dc} ที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการทดลองที่ 5.7.1.

5.8. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

- 5.8.1. ให้สรุปสิ่งที่เรียนรู้ทั้งหมดจากการทดลองแยกเป็นอีกหัวข้อหนึ่งในท้ายรายงาน โดยสรุปเรียง ตามลำดับเรื่องที่ทดลอง.
- 5.8.2. อภิปรายเปรียบเทียบผลของอุณหภูมิที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงจุคทำงานสงบของวงจรต่างๆ ซึ่งได้ คำนวณไว้แล้ว. วงจรใดให้เสถียรภาพของจุดทำงานสงบดีที่สุด.